

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Evaluación y diagnóstico de las puntas del Microscopio de Fuerza Atómica (MFA)

Es un método que permite evaluar el estado del sensor o la punta de barrido de un microscopio de fuerza atómica. Las puntas de nitruro de silicio son las que dan la resolución a las imágenes. Si las puntas se encuentran deterioradas, producirán imágenes falsas en la muestra. Este método contiene además un dispositivo de calibración con trazas nucleares, una nueva opción en el diagnóstico de los MFA.

VENTAJAS



- Opción sencilla para la verificación del estado y el control de calidad de las puntas del microscopio.
- Sustituye a otros métodos de diagnóstico como el microscopio de barrido, obleas de silicio, etc.
- Es un método confiable para la obtención de imágenes y en los parámetros de análisis.

APLICACIONES

Industria e Investigación.

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

Lista para transferencia y comercialización.